



**Nordson**  
SONOSCAN

## NORDSON SONOSCAN C-SAM® GEN7™

Il microscopio acustico a scansione C-SAM® Gen7™ appartiene all'ultima generazione di macchinari per l'Acoustic Micro Imaging (AMI). I miglioramenti includono le tecnologie più all'avanguardia, estetica ed ergonomia con la più ampia gamma di funzioni disponibili.

Che si tratti di analisi guasti non distruttive, sviluppo di processi, ricerca e sviluppo, qualifiche High-Rel per applicazioni militari o screening a basso / medio volume, il Gen6 è un sistema C-SAM in grado di soddisfare tutte queste vostre esigenze. Questo macchinario è perfetto per una vasta varietà di applicazioni, tra cui Microelettronica, MEMS, LED SSL, moduli di potenza, pannelli solari, materiali avanzati, ecc.

Funzionalità avanzate di Sonoscan come PolyGate™, SonoSimulator™, Virtual Rescanning Mode (VRM)™ e Frequency Domain Imaging (FDI)™ aggiungono valore e affidabilità alle analisi. Con la sua ampia area di scansione illuminata a cui è facile accedere, Gen7 ha la capacità di scansionare in modo efficiente qualsiasi cosa, da una piccola parte a un wafer da 300 mm.

Oltre ad essere ricco delle principali innovazioni Sonoscan, il Gen7 è stato progettato con cura pensando all'utente. Le sue caratteristiche ergonomiche lo rendono facile e comodo da usare. Il software Sonolytics™ 2 e i menu intuitivi dell'interfaccia grafica aiutano a massimizzare i risultati, facendo risparmiare tempo all'operatore. Inoltre, l'ampia area di accesso e la fase di campionamento mediante un punto riferimento, facilitano il carico e lo scarico dei campioni.

### LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SONOSCAN GEN7 SONO:

- Risoluzione monitor 4K
- Software Sonolytics™ 2
- Area di scansione ampliata del 23% (rispetto al Gen6)
- Tecnologia PolyGate™ con funzioni Multi-Gate™ e Probing-Gate™ in grado di eseguire immagini singole e multi-focus
- Fino a 100 gate per canale con frequenza di campionamento di 2 Gsps
- Windows® 10 64 bit multilingue
- Scanner bilanciato a motore lineare con contrappeso per ridurre al minimo le vibrazioni e garantire risultati di scansione ottimali
- Piattaforma di scansione montata su torre
- Area di scansione ad accesso facilitato in grado di ospitare vassoi JEDEC, wafer da 300 mm o parti fino a 350 mm
- Disponibili opzioni di ricircolo dell'acqua e controllo della temperatura
- Virtual Rescanning Mode (VRM)™ che memorizza tutti i dati di una scansione e consente di eseguire diverse analisi, anche quando il campione non è più disponibile
- SonoSimulator™ che aiuta nella scansione di campioni sottili e multistrato, come stacked die

ELEXIND S.p.A.

Via A. Erba 35/37 - 20066 Melzo (MI) - Italy - T. +39 02.92.72.15.1 r.a. - F. +39 02.92.10.33.89  
info@elexind.it

© Elexind S.p.A. - Tutti i marchi e le immagini appartengono ai legittimi proprietari.

www.elexind.it 